



総 数 2頁の1頁
証明書番号 2014-0000

検査証明書

依頼者

住所

品名

型式

数量

製造番号

製造者 株式会社 渋谷光学

検査項目 寸法

検査方法 精密自動二次元座標測定機にて測定

環境条件 測定時の温度を記載

検査年月日

検査結果は次頁以降のとおりであることを証明します。

埼玉県和光市新倉三丁目22番2号
TEL: 048-469-1200・FAX: 048-469-1311
株式会社渋谷光学
代表取締役社長 下平誠一郎



この証明書は、システムアドバンス株式会社(埼玉県川越市芳野台2-8-28)に検査を委託して
その結果に基づき株式会社渋谷光学が発行し、検査結果を保証するものです。



検 査 結 果

(測定温度：測定時の温度℃)

目 盛 の 長 さ

目 量

使用した常用参照標準器等

品 名	製造者名	型式又は性能	識別番号
精密自動二次元座標測定機	新東Sプレジジョン株式会社	SMIC-300III	090103
		SMIC-800III S	040404

備 考

特 記 事 項 検査品の受理後、修理及び調整を行わず検査を実施した。

以 上

座標測定機 X・Y軸トレーサビリティ体系図

